

## СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации Волкова Юрия Олеговича

«Диагностика поверхностей твердотельных и комплексных жидкофазных систем методами рентгеновской рефлектометрии и диффузного рассеяния в условиях скользящего падения излучения», представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 — «физика конденсированного состояния».

Полное наименование организации	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“»
Сокращённое наименование организации	НИТУ «МИСиС»
Место нахождения	Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4
Почтовый адрес организации с указанием индекса	119049 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4
Телефон с указанием кода города	+7 (495) 955-00-32
Адрес электронной почты	<a href="mailto:kancela@misis.ru">kancela@misis.ru</a>
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	<a href="http://www.misis.ru">http://www.misis.ru</a>
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	1. Bublik V.T., Shcherbachev K.D., Voronova M.I., Mordkovich V.N., Pazhin D.M., Zinenko V.I., Agafonov Yu.A. <i>Influence of the Chemical Nature of Implanted Ions on the Structure of a Silicon Layer Damaged by Implantation</i> // Crystallography Reports, 2013. V. 58, p.1030-1036 2. K.D.Shcherbachev, V.V. Privezentsev, V.S.Kulikauskas, V.V. Zatekin <i>Defect Structure Transformation During Thermal Annealing in a Surface Layer of Zn Implanted Si(001) substrates</i> // Journal of Applied Crystallography, 2013, 46, p882-886 3. V.V. Saraykin, K.D. Shcherbachev, D.V. Petrov, V.V. Privezentsev <i>Near surface layer evolution in Zn<sup>+</sup> ions implanted Si upon annealing treatments</i> // Applied Surface Science 267 (2013) 97– 100 <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.08.006">http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.08.006</a> 4. K.B. Eidelman, K.D. Shcherbachev, N.Yu. Tabachkova, D.A. Podgornii, V.N. Mordkovich



Characterization of crystal structure features of  
a SIMOX substrate // Nuclear Instr. Meth. (2015)  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.08.050>

Составили: проф., д.ф.-м.н. Бублик В.Т.

к.ф.-м.н., вед. инж. Щербачев К.Д.

(подпись, печать организации)

ПОДПИСЬ  
Проректор  
по общим вопросам  
НИТУ «МИСиС»



ЗАВЕРЯЮ  
И.М. ИСАЕВ